

动态偏压可靠性设备ME100DHTXB



亮点

● 一机多用

同一系统,实现DHTGB, DHTRB, DHTGB+DHTRB一体三种功能

同时可兼容HTGB, HTRB功能

● 使用灵活

每个抽屉独立,匹配独立电源,不同抽屉可实现不同条件,不同封装器件同步老化

老化条件,检测频次,判断标准,测试项目,测试方法可编程

● 大容量

一个柜体内置5个抽屉,最多可配4个柜体

每个抽屉器件数:TO247 24工位,HPD 8工位,DCM 20工位

● 升级方便,节省成本

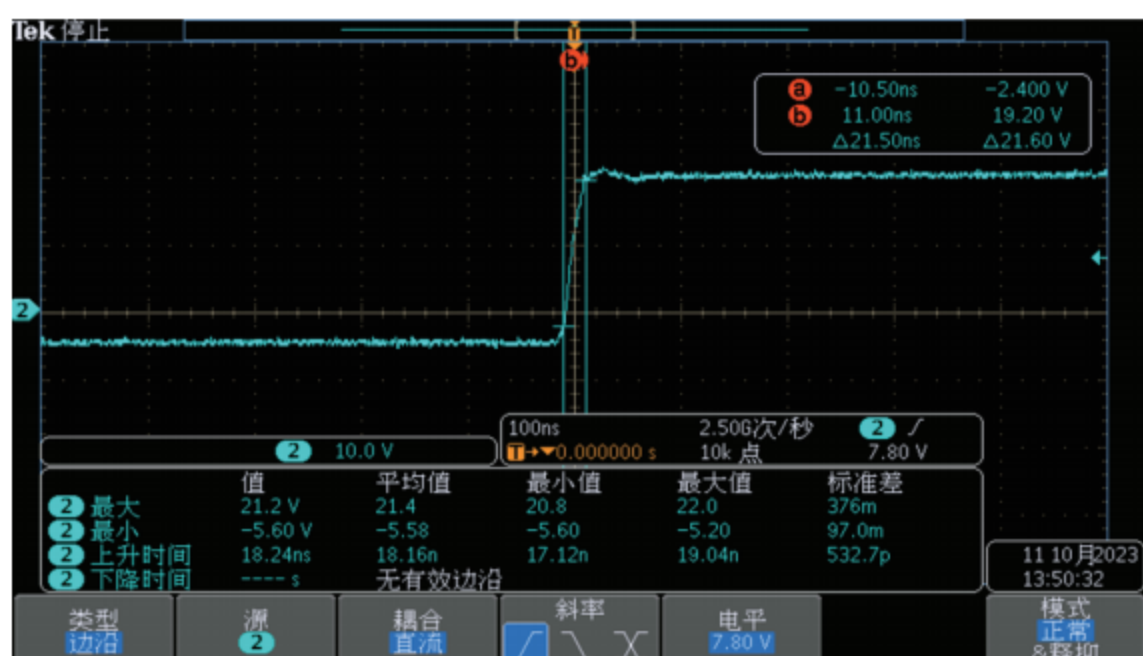
不同柜体任意选配DHTGB/DHTRB

增加不同封装器件老化,新增对应抽屉即可,无需再次购买整个设备

ME100DHTXB技术参数

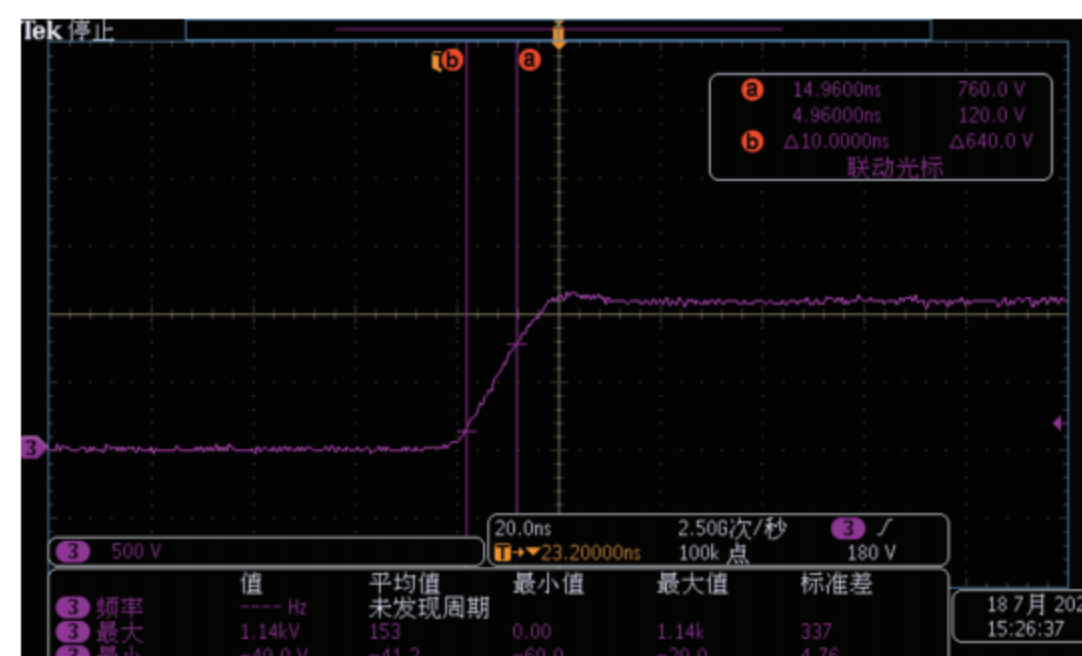
老化条件	指标	测试项目	指标
DHTGB			
频率	范围:0~500kHz(单管),0~100kHz(模块) 精度:2%FS±0.2kHz	I_{GSS}	范围:0.1nA~100mA,最高分辨率0.1nA 每个工位均有1:1定制的高精度仪表,实时监测
V_{GS}	范围:-40~40V,精度:1%RD±0.1V,0.05V	V_{GSth}	范围:0~10V,分辨率:3mV,精度:±1%RD±20mV I_{GS} 范围:0~1A,分辨率:50μA,精度:±1%SET±100μA
dV_{GS}/dt	>1V/ns	过冲	无过冲
占空比Duty	100kHz以内:0%~100%,步长1% 100kHz以上:10%~90%,步长1% 精度:2%FS±0.2%,0.1%		
DHTRB			
频率	范围:0~500kHz(单管),0~100kHz(模块) 精度:1%FS±0.2kHz,0.1kHz	I_{DSS}	范围:0.1nA~100mA,最高分辨率0.1nA 每个工位均有1:1定制的高精度仪表,实时监测
V_{DS}	范围:0~2000V(兼容主被动方案) 精度:0.5%±10mV	$R_{DS(on)}$	范围:0~60mV($I_{DS} * R_{DS(on)}$)
dV_{DS}/dt	>80V/ns	过冲	<15%
占空比Duty	0%~100%,步长1%,1%RD±0.2%,0.1%		
试验温度			
温度范围	常温~220°C,分辨率0.1°C 精度:±2°C,温度均匀性≤3°C	梯度	室温~175°C温度波动度≤1°C 176~220°C温度波动度≤3°C
加热方式	专用夹具	功率	单个夹具26W(TO247)

DGB实测波形



du/dt 1V/ns, 无过冲

DRB实测波形



du/dt 64V/ns, 过冲<1%